



## RINGKASAN

NAUFAL YODANSAH. Perencanaan *Hazard Analysis Critical Control Point* Produk Wafer *Stick* di PT Javaindo Maju Sejahtera, Depok (*Planning of Hazard Analysis Critical Control Point of Wafer Stick Products at PT Javaindo Maju Sejahtera, Depok*). Dibimbing oleh MRR. LUKIE TRIANAWATI.

Perkembangan industri pangan saat ini semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan, terlebih di masa pandemi, kebutuhan masyarakat terhadap pangan menjadi suatu hal yang sangat penting. Pangan yang baik bukan hanya enak, melainkan pangan yang sehat, bergizi dan aman untuk dikonsumsi. Hal tersebut menjadikan industri pangan harus menyediakan produk yang berkualitas dan aman bagi konsumen. Dalam perkembangannya, isu terkait jaminan mutu dan keamanan pangan semakin meningkat seiring dengan tuntutan konsumen, tingkat kehidupan, dan kesejahteraan manusia. Penerapan *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) penting dilakukan industri untuk menjamin keamanan produk dengan upaya pencegahan bahaya yang terjadi pada produk. Penilaian bahaya pada sistem HACCP meliputi identifikasi bahaya pada setiap tahapan dalam rantai produksi termasuk bahan yang digunakan dan mengendalikan bahaya tersebut agar tidak terjadi.

Perencanaan sistem HACCP pada proses produksi wafer *stick* di PT Javaindo Maju Sejahtera terdiri dari beberapa tahapan meliputi pembentukan tim HACCP, deskripsi produk, identifikasi penggunaan produk, penyusunan dan verifikasi diagram alir, analisa bahaya, baik dari bahan baku maupun tahapan proses produksi, titik kendali kritis, penetapan batas kritis, pemantauan, tindakan koreksi, Verifikasi rancangan HACCP, dan dokumentasi. Metode yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap proses produksi, kontribusi dalam proses pengolahan, diskusi panel bersama staf, serta pengumpulan data dari dokumen internal perusahaan dan studi literatur.

Hasil perencanaan sistem HACCP pada produk wafer *stick* menunjukkan bahwa setelah dilakukan analisa terhadap bahaya bahan baku dan proses produksi serta penetapan titik kendali kritis menggunakan pohon keputusan, tim HACCP menetapkan satu CCP dalam proses produksi wafer *stick* yaitu pada tahapan pendeteksian logam untuk mendeteksi keberadaan kontaminasi produk akibat bahaya fisik *metal parts*. Batas kritis pada proses deteksi logam yaitu tidak terdeteksi adanya bahaya fisik serpihan logam. Pemantauan CCP proses dilakukan dengan pengamatan dan pengukuran terhadap sensitivitas alat *metal detector*. Verifikasi CCP proses dilakukan dengan peninjauan hasil *monitoring* tingkat sensitivitas *metal detector* dan analisa produk akhir.

Dalam mencapai penerapan sistem HACCP yang maksimal, komitmen dan konsistensi tinggi dari manajemen sangat diharapkan untuk menciptakan kesinambungan pada semua sektor dalam penerapan prinsip-prinsip HACCP di PT Javaindo Maju Sejahtera. Selain itu diperlukan pelatihan terkait HACCP secara berkala untuk karyawan sehingga dapat meningkatkan kepedulian tentang pengendalian titik kritis dalam proses produksi wafer *stick*.

Kata kunci : HACCP, keamanan pangan, *metal detector*, *quality control*, wafer *stick*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.